

УДК 548.0 : 535

## ПЛАЗМОН-ФОНОННЫЙ РЕЗОНАНС В ТИТАНАТЕ СТРОНЦИЯ

*M. C. Козырева*

Рассмотрено взаимодействие продольных оптических фононов и продольных колебаний свободных носителей заряда (плазменных колебаний) в проводящих образцах титаната стронция. Произведен расчет частоты плазменных колебаний с учетом этого взаимодействия. Данные расчета удовлетворительно согласуются с экспериментом.

В случае, когда частота продольных оптических фононов  $\omega_L$  в кристалле близка по порядку величины к частоте продольных колебаний свободных носителей заряда  $\omega_p$  (плазменной частоте), вследствие взаимодействия этих двух видов продольных колебаний в кристалле возникают смешанные плазмон-фононные колебания. Особенно заметно они проявляются в полярных кристаллах, когда при сильной поляризации ионной кристаллической решетки вклады продольных фононов  $\hbar\omega_L$  и продольных колебаний свободных носителей заряда  $\hbar\omega_p$  могут быть соизмеримы в дисперсионном соотношении диэлектрической проницаемости  $\epsilon$ .

Дисперсионное соотношение диэлектрической проницаемости для кристалла с кубической симметрией и одной продольной  $\hbar\omega_L$  и поперечной  $\hbar\omega_t$  оптическими модами колебаний без учета явлений затухания будет иметь вид в длинноволновом приближении ( $\mathbf{q} \rightarrow 0$ )

$$\epsilon(\omega, 0) = \epsilon_\infty \left[ 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} + \frac{(\epsilon_s/\epsilon_\infty - 1) \omega_t^2}{\omega_t^2 - \omega^2} \right], \quad (1)$$

где  $\omega_p^2 = e^2 N / m^* \epsilon_\infty / \epsilon_0$ ,  $\epsilon_s/\epsilon_\infty = \omega_L^2/\omega_t^2$ ,  $\epsilon_s$  и  $\epsilon_\infty$  статическая и оптическая диэлектрические проницаемости,  $\epsilon_0$  — диэлектрическая проницаемость вакуума,  $e$  — заряд электрона,  $m^*$  — эффективная масса,  $N$  — концентрация свободных носителей заряда.

Положение смешанных плазмон-фононных мод определяется из условия обращения в нуль диэлектрической проницаемости кристалла  $\epsilon(\omega, \mathbf{q}) = 0$ , т. е. из уравнения

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} + \frac{\omega_L^2 - \omega_t^2}{\omega_t^2 - \omega^2} = 0. \quad (2)$$

Частоты смешанных плазмон-фононных мод определяются двумя корнями этого уравнения

$$2\omega_{\pm}^2 = \omega_p^2 + \omega_L^2 \pm [(\omega_p^2 + \omega_L^2)^2 - 4\omega_p^2 \omega_t^2]^{1/2}. \quad (3)$$

Эти частоты при постоянных  $\omega_t$  и  $\omega_L$  в кристалле должны зависеть от  $\omega_p^2$ , т. е. от концентрации свободных носителей заряда. Плазменная частота для различных образцов с разной концентрацией свободных носителей заряда определялась из спектров отражения. Спектры отражения были измерены в области  $60-5000 \text{ см}^{-1}$  на спектрофотометрах UR-20 и Fis-3 и приведены на рис. 1 и 2. Используя соотношения Кра-

мерса—Кронига, спектры отражения были математически обработаны на ЭЦВМ и получена дисперсия действительной  $\epsilon'$  и мнимой  $\epsilon''$  частей диэлектрической проницаемости (рис. 2). В области 1000—5000  $\text{cm}^{-1}$  в частотном ходе  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  не наблюдалось никаких особенностей. Значения  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  в этой области малы и слабо зависели от частоты. В области 60—700  $\text{cm}^{-1}$  наблюдалась значительная дисперсия  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$ . Значения  $\epsilon''$  резко возрастали в длинноволновой области. Наиболее сильные изменения в спектрах отражения проводящих образцов происходили около самой высокочастотной продольной моды ( $\omega_L = 750 \text{ cm}^{-1}$ ), что свидетельствовало о наличии сильного взаимодействия между продольными колебаниями решетки и плазменными колебаниями свободных носителей заряда.

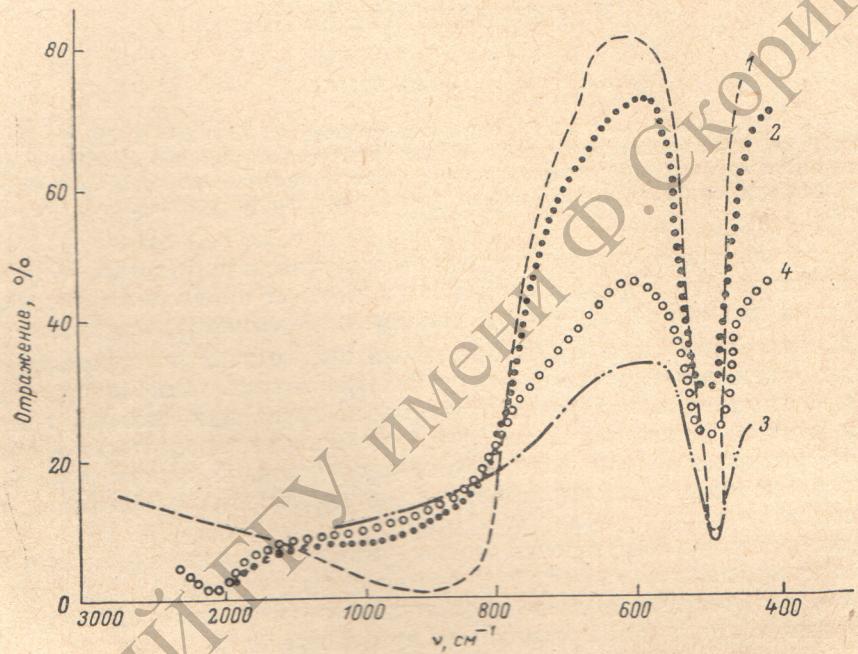


Рис. 1. Спектры отражения монокристаллических образцов титанатов стронция.

1 — стехиометрический, 2 — легированный 0,2 ат. % Nb ( $N=2.5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ), 3 — легированный 1,0 ат. % Ce ( $N=2.0 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ ), 4 — легированный 0,8 ат. % La ( $N=1.4 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ ).

ряда. С ростом концентрации свободных носителей заряда в области металлического отражения коэффициент отражения уменьшался, высокочастотный край полосы металлического отражения постепенно сглаживался, и значения коэффициента отражения в минимуме постепенно увеличивались. Полученные резкие изменения в спектрах отражения проводящих образцов коррелировали с концентрацией свободных носителей заряда, что согласуется с данными [1], полученными для проводящих образцов титаната бария.

Для доказательства существенного влияния свободных носителей заряда на спектр отражения в этой области была рассчитана дисперсия мнимой части диэлектрической проницаемости  $\epsilon''$  для одного из исследуемых образцов титаната стронция. Так как свободные носители заряда и поперечные оптические колебания дают независимые вклады в дисперсионное соотношение (1), то расчет  $\epsilon''$  производился с учетом первых двух слагаемых в (1), т. е. с учетом только вклада свободных носителей заряда. В реальных кристаллах существует сильное затухание колебаний вследствие неупругих столкновений свободных носителей заряда, ко-

торое заметно изменяет спектр отражения реальных кристаллов, поэтому расчет  $\epsilon''$  был произведен с учетом затухания по формуле

$$\epsilon(\omega, 0) = \epsilon_{\infty} \left[ 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - i \frac{\omega}{\tau}} \right]. \quad (4)$$

Фактор затухания  $\tau$  определялся из значений подвижности на постоянном токе. Подвижность в этих проводящих образцах была равна  $u=5-7 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$  [2]. Значение эффективной массы в этих образцах было определено нами из эффекта Фарадея [3]. Эффективная масса для образца  $\text{SrTiO}_3$  с концентрацией свободных носителей заряда ( $N=9.9 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ) была равна  $m^*=1.5 m_0$ . Рассчитанные значения  $\epsilon''(\omega)$  для образца  $\text{SrTiO}_3$  с  $N=9.9 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$  представлены на рис. 2. Из рис. 2 видно, что без учета поперечных оптических мод расчетная кривая  $\epsilon''(\omega)$  удовлетворительно совпадает с кривой, полученной на основе экспериментальных данных. Поскольку полученные изменения в этой области коррелировали с концентрацией свободных носителей заряда и по своей частотной зависимости спектры отражения были характерны для плазменного отражения (при временах релаксации  $\tau$ , сравнимых по величине с  $1/\omega_p$ ), то из спектров отражения можно было определить  $\omega_p$ .

Плазменная частота определялась по точке начала резкого спада металлического отражения в коротковолновой области, а именно по частоте, при которой  $dR/d\phi = \text{max}$ . Полученная таким образом  $\omega_p$  и ее концентрационная зависимость для  $\text{SrTiO}_3$  приведена на рис. 3. Из рис. 3 видно, что  $\omega_p^2$  линейно возрастала с увеличением концентрации свободных носителей заряда. Плазменная частота с увеличением концентрации свободных носителей заряда, как и следовало ожидать, смещалась в коротковолновую область.

Более размытый характер спектров отражения в области плазменного резонанса объясняется сильным взаимодействием частоты продольных оптических фононов с плазменной частотой. Расчет частоты плазменных колебаний с учетом этого взаимодействия приводит к появлению двух ветвей частот  $\omega_+$  и  $\omega_-$ , которые для  $\text{SrTiO}_3$  приведены на рис. 4 в зависимости от концентрации свободных носителей заряда. Из рис. 4 видно, что при малых  $N$ , т. е. при  $\omega_p^2 < \omega_L^2$  высокочастотная ветвь  $\omega_+$  определяется в основном продольными оптическими модами  $\omega_+^2 = \omega_L^2$ , а низкочастотная ветвь  $\omega_-$  соответствует плазменным колебаниям  $\omega_-^2 = \omega_p^2 \frac{\epsilon_{\infty}}{\epsilon_s}$ .

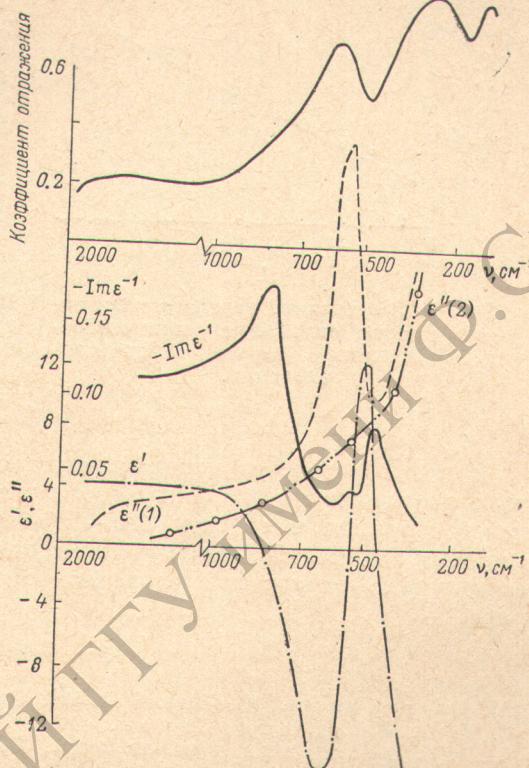


Рис. 2. Спектры отражения и дисперсия действительной  $\epsilon'$  и мнимой  $\epsilon''$  частей диэлектрической проницаемости для восстановленного в  $\text{H}_2$  образца титаната стронция ( $N=9 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ). 1 — экспериментальная  $\epsilon''$ , 2 — рассчитанная по (4).

В области высоких концентраций свободных носителей  $\omega_+$  ветвь имеет в основном плазменный характер, а низкочастотная ветвь соответствует поперечным оптическим фононам и  $\omega_-^2 = \omega_t^2$ .

В области частот между  $\omega_L$  и  $\omega_t$  находится полоса запрещенных частот, в которой электромагнитные волны не поглощаются веществом, а полностью от него отражаются (это так называемая область металлического отражения).

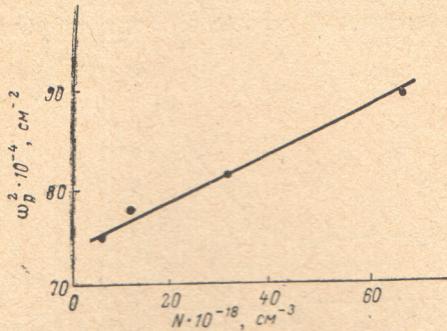


Рис. 3. Зависимость квадрата плазменной частоты от концентрации свободных носителей заряда в титанате стронция.

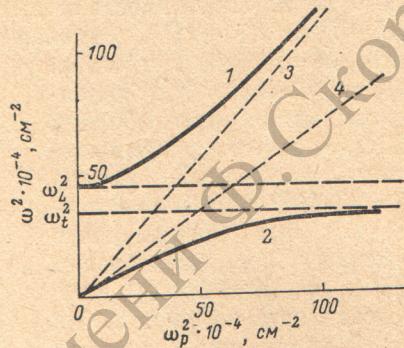


Рис. 4. Зависимость квадратов частот плазмон-фононного резонанса от концентрации свободных носителей заряда.

$$1 - \omega_+^2, 2 - \omega_-^2, 3 - \omega = \omega_p^2, 4 - \omega^2 = \omega_p^2 \frac{\omega_t^2}{\omega_p^2 + \omega_t^2}.$$

Таким образом, из наших данных следует, что наблюдаемые значительные изменения в спектрах отражения проводящих образцов титанатов стронция в области  $300-1000 \text{ см}^{-1}$  можно объяснить влиянием сильного взаимодействия двух типов продольных колебаний: продольных оптических фононов и продольных колебаний свободных носителей заряда.

#### Литература

- [1] P. Gerthen et al. Phys. Stat. Sol., 11, 303, 1965.
- [2] М. В. Рождественская. ФТТ, 12, 873, 1970.
- [3] М. С. Козырева. Опт. и спектр., 39, 525, 1975.

Поступило в Редакцию 6 июля 1976 г.